## 局所 C-V マッピングにおける主成分分析によるノイズ除去 Noise Reduction by Principal Component Analysis for Local C-V Mapping 東北大<sup>1</sup>.東工大<sup>2</sup> <sup>0</sup>平永良臣<sup>1</sup>, 三村和仙<sup>2</sup>,清水荘雄<sup>2</sup>,舟窪浩<sup>2</sup>,長康雄<sup>1</sup>

Tohoku Univ.<sup>1</sup>, Tokyo Tech.<sup>2</sup>, <sup>o</sup>Yoshiomi Hiranaga<sup>1</sup>, Takanori Mimura<sup>2</sup>, Takao Shimizu<sup>2</sup>,

Hiroshi Funakubo<sup>2</sup>, Yasuo Cho<sup>1</sup>

E-mail: hiranaga@riec.tohoku.ac.jp

【はじめに】近年我々は、強誘電体材料におけるナ ノスケール分極反転ダイナミクスを評価する新たな ツールとして、局所 C-V マッピング法を提案してい る.<sup>[1]</sup>本手法はサンプルに分極反転を引き起こすよ うな比較的大きな正弦波バイアスを印加し、その時 に生ずる静電容量の変化を走査型非線形誘電率顕微 鏡 (SNDM)のプローブにより検出するものである. サンプルが強誘電分極反転を伴う場合、観察される 局所 C-V 曲線はマクロ測定に類似したバタフライ型 の履歴曲線となり、これを解析することによって、 ナノスケール分極反転に関する様々な情報を得るこ とが出来る.

SNDM プローブの高い容量検出感度は,自発分極 量がある程度大きい (≥10µC/cm<sup>2</sup>) 測定対象に対して は,平均化処理無しでの C-V 曲線の観察までも可能 とするが,自発分極値が小さい測定対象などにおい ては,C-V 曲線の測定精度をさらに高めることは有 益である.このような目的において,主成分分析 (PCA)を用いたノイズ除去が有効であることが知 られている.<sup>[2]</sup> そこで,本研究では局所 C-Vマッピ ング法において得られた測定データに対し,PCA ノ イズ除去を適用し,その測定精度をさらに高めるこ とを試みた.

【実験方法】本測定における装置構成はおおむね通 常の SNDM とほぼ同一だが,非常に高い次数までの 高調波像の取得を可能とするためにロックインアン プの代わりにデジタイザを導入した.デジタイザで 収録された応答信号の時間波形を後処理においてフ ーリエ級数展開(N=30 次の係数まで取得)すること で,ロックイン検波と等価な処理を行った.測定サ ンプルとしては、ランダム配向 HfO2 基強誘電体薄膜 を選び,その 4µm×2µm の範囲を 256×128 ピクセルの 解像度で測定した.得られたデータセットに対し, 主成分分析を行い,第L主成分(L < 2N)までを用 いて応答波形を復元することでノイズ除去を行った.

【実験結果】得られた 30 次までの高調波振幅像のうち一部の抜粋を Fig.1 に示す.これらの像において,



Fig. 2 Typical local C-V curves resynthesized from the obtained dataset shown in Fig. 1.

分極反転特性の面内分布に対応した不均一な分布が 観察されている. SNDM の高い検出感度によって 30 次もの極めて高い次数の高調波像においても, S/N 比 は高くないはものの,有意なパターンが観察された. 適切なノイズ除去を行うことが出来れば,このよう な高調波像も C-V 曲線再合成の高精度化に資するこ とが出来る.

取得されたデータセットより,256×128の全ての 画素に対して C-V 曲線の再合成が可能であるが,そ のうちの一部を Fig.2 に示す.第2高調波像の明暗部 において,それぞれスイッチング領域/非スイッチ ング領域に特徴的な C-V 曲線が観察された.

得られたデータセットに対して, PCA を通じたノ イズ除去を行った結果を Fig. 3 に示す. 元データにお いて見られていたシステムノイズ由来の振動成分が, PCA フィルタの効果によって低減されたことが分か る. 通常の周波数フィルタでは, このようなノイズ の低減と, 元の信号に含まれている急峻な変化を維 持することはトレードオフの関係になるが, PCA フ ィルタの導入によって, これらを両立させることに 対し一定の効果が確認された.

【謝辞】本研究の一部は科学研究費補助金(16H06360, 18K04932)の補助を受けています.

- Y. Hiranaga, T. Mimura, T. Shimizu, H. Funakubo, and Y. Cho, J. Appl. Phys. **128**, 244105 (2020).
- [2] S. Jesse and S. V Kalinin, Nanotechnology 20, 85714 (2009).



Fig. 1 Harmonic images observed with a randomly oriented HfO<sub>2</sub>-based ferroelectric thin film.



**Fig. 3** Local C-V curve after PCA filtering.